

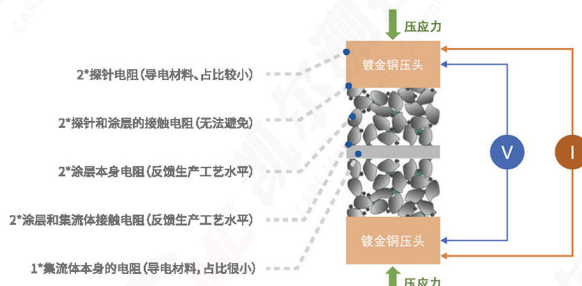
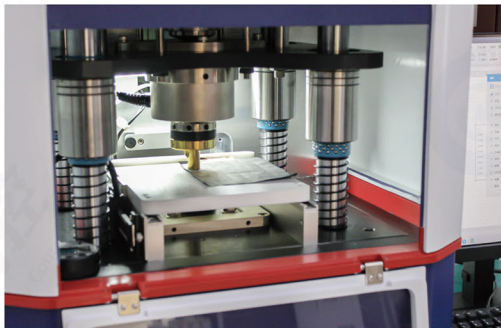
适用于测试电池、电容器等电子元器件电阻率

测试对象：双面极片、单面极片、底涂集流体、集流体。

高精度的压应力控制，更自由的压应力加载方式，经柔度修整的厚度精确测量。

高精度、变量程的交流电阻测量，手动、自动送样，多点测量、环境温、湿度同步记录。

软件一键输出各数据云图，清晰直观显示极片中各关键参量分布情况。

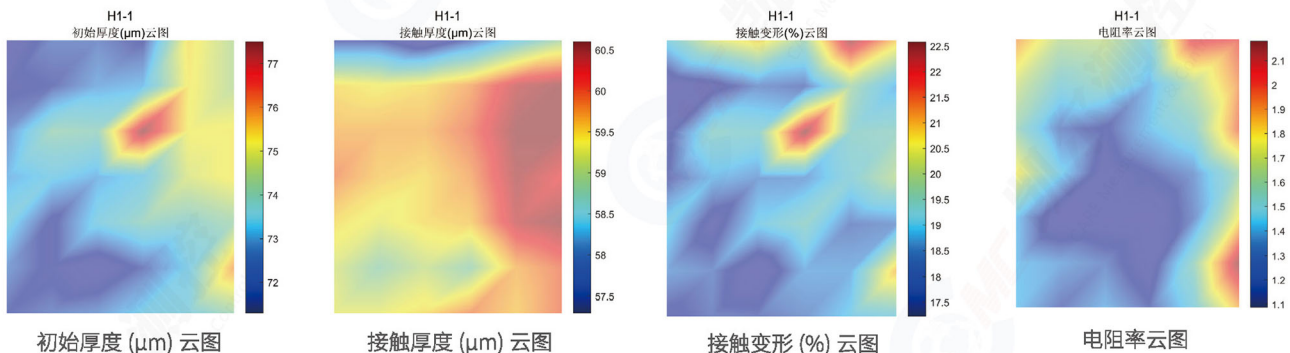


两探针测试原理方法

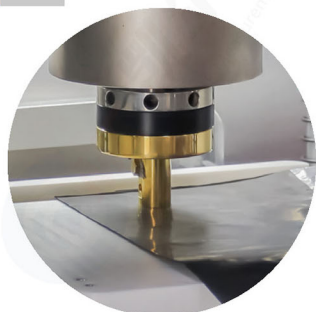
- 初始厚度: 初始轻微接触下的厚度
- 接触厚度: 极片受压后的厚度
- 接触变形: 计算压缩形变量 = (初始厚度 - 接触厚度) / 初始厚度
- 极片电阻: 两探针法得到总电阻值
- 电阻率: 使用接触厚度计算电阻率
- 统计学分析数据

	初始厚度 (μm)	接触厚度 (μm)	接触变形 (%)	极片电阻 ($\text{m}\Omega$)	电阻率 ($\Omega\cdot\text{cm}$)	电导率 (S/cm)
样本均值	73.455	59.498	18.986	5.835	1.510	0.686
样本极差	6.201	3.301	5.356	4.310	1.093	0.461
样本方差	1.877	0.647	1.558	0.000	0.085	0.016
样本标准差	1.370	0.804	1.248	0.001	0.292	0.127
变异系数(%)	1.865	1.352	6.574	19.320	19.312	18.497

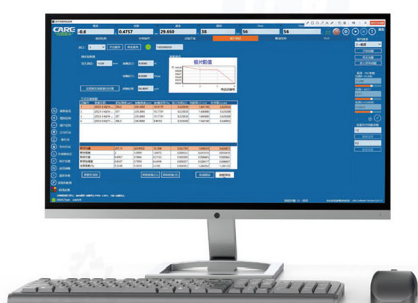
测试云图



极片电阻率分布测试系统



内部集成进口交流电阻仪



高刚度机架

设备型号	ERDT-10k	
电阻测量	量程	0.1 $\mu\Omega$ ~3.1k Ω
	精度	$\pm 0.5\%$ F.S
	最小分辨率	0.1 $\mu\Omega$
厚度测量	量程	0~50mm
	精度	$\pm 0.1\mu\text{m}$
	最小分辨率	0.1 μm
载荷测量	量程	10kN (65MPa)
	精度	$\pm 0.3\%$ F.S
	最小分辨率	0.1N
温度测量	量程	0-80 $^{\circ}\text{C}$
	精度	$\pm 2^{\circ}\text{C}$
湿度测量	量程	5~95%RH
	精度	$\pm 3\%$ RH
测试原理	双探针法 + 进口交流电阻仪 + $\phi 14\text{mm}$ 镀金铜柱	
电阻标定	20m Ω 、1 Ω 、10 Ω 等多档位标定	
尺寸 (长*宽*高)	420*340*800mm	
结果输出	初始厚度、形变、载荷、电阻率、电阻、压实密度、电导率、温湿度、云图、统计数据	

